

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 31.08.2007 faxen an
(030) 63 92 – 65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Vortrag ja nein Poster ja nein

Titel des Vortrages / Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

100,00 € bei Überweisung bis zum 30.09.2007, Studentenrabatt 50%
150,00 € bei späterer Überweisung an:
IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00 · Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 50,00 €/m² bei Überweisung bis zum 30.09.2007,
70,00 € bei späterer Überweisung.

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 57,00 € für ein EZ plus 11,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

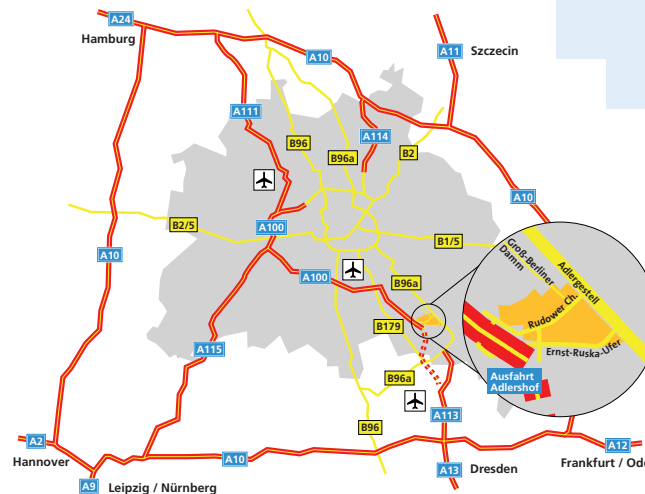
VDI/VDE – Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.;
IfG – Institute for Scientific Instruments GmbH
FhG-IZM (Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin
Geschäftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Technische Universität Berlin

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92 – 65 09
Fr. Ch. Rabe (Sekretariat IAP e. V. und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92 – 65 00
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: (030) 63 92 – 65 01
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

E. Auerswald, IZM, Berlin
B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgäzy, Bruker axs GmbH, Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
M. Haschke, IfG GmbH, Berlin
A. Janßen, FH Münster
K. Janssens, Universität Antwerpen, Belgien
B. Kanngießner, TU Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
R. Meier, PANalytical, Almelo, Niederlande
H. Miersch, Spectro GmbH & Co. KG, Kleve
U. Panne, BAM und Humboldt-Universität, Berlin
M. Procop, BAM, Berlin
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
G. Schneider, BESSY GmbH Berlin
Th. Schüle, Bruker axs Microanalysis GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht



Anfahrtskizzen auch unter www.wista.de



Tagungsankündigung

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

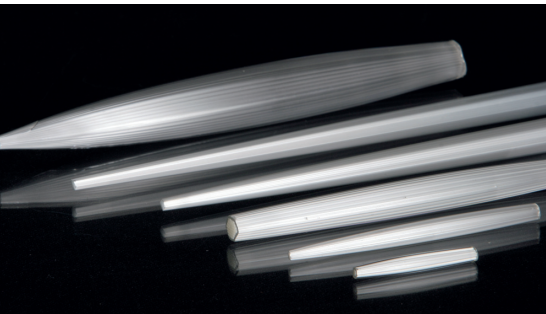
15. und 16. November 2007

am WISTA – Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Berlin-Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



Ziele und Inhalte der Fachtagung



Die Fachtagung PRORA 2007 setzt die im Jahre 2001 begonnene Tagungsreihe zur prozessnahen Röntgenanalytik fort. Sie wird am 15. und 16. November 2007 wie bisher am Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof stattfinden. Durch die Weiterentwicklung moderner Technologien und der damit erhöhten Anforderungen an die Steuerung von Produktionsabläufen und die Qualitätskontrolle gewinnt die Prozessanalytik immer mehr an Bedeutung. Damit innerhalb der technologischen Prozesse in sehr kurzer Zeit Regelungen vorgenommen werden können, sind kurze Messzeiten und hocheffektive, in der Regel zerstörungsfreie Analysemethoden erforderlich. Derartige Verfahren sollen u. a. bei der Fachtagung PRORA 2007 eingehender diskutiert werden. Zur Tagung sind interessierte Fachkollegen aus allen Bereichen der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Geräten und Verfahren der prozessnahen Röntgenanalytik aber auch Studenten und Doktoranden der entsprechenden Fachrichtungen herzlich eingeladen. Es wird um die Anmeldung von Beiträgen bis zum 31. August 2007 gebeten. Das Programmkomitee behält sich die Einordnung als Vortrag oder Poster vor, um ausreichend Platz für Diskussionen zu schaffen. Die einzelnen Programmschwerpunkte werden durch eingeladene Vorträge eingeleitet.

Wie gewohnt wird eine Geräteausstellung die Tagung begleiten und ergänzen.

Zusätzlich zu der Tagung wird am Sonnabend, dem 17. November 2007, ein spezieller Satellite – Workshop zum Thema »Zeitaufgelöste Röntgenanalytik« stattfinden. Während dieser Zusatzveranstaltung sollen neueste Forschungsergebnisse auf diesem interessanten Gebiet Vertretern sowohl aus Forschung und Entwicklung insbesondere auf den Gebieten Life Sciences und Materialwissenschaften als auch der Industrie vorgestellt und dadurch ein langfristiger Technologietransfer vorbereitet werden.

Folgende Schwerpunktthemen sind für die PRORA vorgesehen:

Methodische Besonderheiten der Prozessanalytik

- Probennahme und -präparation
- Softwareentwicklungen zur quantitativen Röntgenanalytik für prozessnahe Anwendungen
- Röntgenanalytik bei erhöhten Temperaturen
- On-line und At-line-Methoden

Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte sowie Anforderungen an prozessnahe Geräte und Beispiele für eine erfolgreiche Realisierung

- Kompakte Röntgenquellen
- Röntgenoptiken und Monochromatoren
- Röntgendetektionssysteme
- Mobile RFA-Spektrometer und Röntgendiffraktometer
- Ortsauflösende Röntgenanalysengeräte

Applikationen in Industrie und Forschung

- Analytik für die Photovoltaik
- Halbleiteranalytik (Kontaminationskontrolle, vergrabene Schichten inkl. Ultrashallow Junctions)
- Partikel- und Phasenanalyse mit röntgenanalytischen Methoden

Spezielle Entwicklungen

- Röntgentomographie
- Röntgenmikroskopie
- Zeitaufgelöste Verfahren
- Einsatz weicher und sehr harter Röntgenstrahlung
- Röntgenemissions- und -absorptionsspektroskopie
- Röntgenwellenleiter